

Описание разрешения нейтронного порошкового дифрактометра с фокусирующим монохроматором при ненулевом угле Фанкухена	
<i>В. И. Бобровский</i>	5
Термостабильность органических слоистых систем на основе стеарата свинца	
<i>М. А. Марченкова, Ю. А. Дьякова, А. Ю. Серегин, А. С. Орехов, В. В. Клечковская, Л. Р. Имамова, Е. Ю. Терещенко</i>	14
Особенности трансформации наноалмазов детонационного синтеза в луковичнообразные углеродные наночастицы	
<i>В. А. Попов, А. В. Егоров, С. В. Савилов, В. В. Лунин, А. Н. Кириченко, В. Н. Денисов, В. Д. Бланк, О. М. Вяселев, Т. Б. Сагалова</i>	20
Проекционная рентгеновская дифракционная топография – возможности количественного анализа изображений дефектов	
<i>Э. В. Суворов, И. А. Смирнова</i>	30
Рентгенографическое исследование структуры слоя насыпной насадки, ограниченного цилиндрической поверхностью	
<i>А. С. Пушинов, К. В. Чиж, М. Г. Беренгартен</i>	34
Низкотемпературные рентгенографические исследования монокристаллов $TlInS_2$, $TlGaS_2$ и $TlGaSe_2$	
<i>А. У. Шелег, В. В. Шевцова, В. Г. Гуртовой, С. Н. Мустафаева, Э. М. Керимова</i>	39
Рентгено-интерферометрическое исследование полей деформаций в кристаллах кремния, возникающих под действием постоянного магнитного поля	
<i>Г. Р. Дрмеян, А. О. Абоян, А. А. Мовсисян</i>	43
Структура поверхности крупногабаритных монокристаллов германия	
<i>И. А. Каплунов, О. В. Малышкина, А. И. Колесников, Р. М. Гречишкин, Е. И. Каплунова, А. И. Иванова</i>	47
Влияние температуры и электронного облучения на состав поверхности силикатной полупроводящей глазури	
<i>И. Н. Сергеев, В. К. Кумыков, В. А. Созаев</i>	51
Структура и электронные свойства поверхности оксианионных кристаллов	
<i>Д. В. Корабельников, Ю. Н. Журавлев</i>	55
О выборе начального приближения в методе конфлюэнтного анализа для катодолуминесцентной идентификации параметров прямозонных полупроводниковых материалов при квадратичной рекомбинации неосновных носителей заряда	
<i>Н. А. Никифорова, А. Н. Поляков, Н. Н. Михеев, М. А. Степович</i>	60
О модифицированной проекционной схеме метода наименьших квадратов для моделирования распределения неосновных носителей заряда, генерированных электронным пучком в однородном полупроводниковом материале	
<i>Е. В. Серегина, М. А. Степович, А. М. Макаренков</i>	65
Измерение нелинейности сканирования в растровом электронном микроскопе	
<i>Ю. А. Новиков</i>	70
Тушение люминесценции в оксиде цинка, модифицированном нанопорошками Al_2O_3 и $Al_2O_3 \cdot CeO_2$, при облучении протонами	
<i>М. М. Михайлов, В. В. Нецименко, Чундун Ли, Банг-Дзяо Йе</i>	75

Численное моделирование высокоперевансной ионно-оптической системы с плазменным эмиттером

В. К. Абгарян, Р. В. Ахметжанов, Х. В. Лёб, В. А. Обухов, М. В. Черкасова

82

Исследование углового и энергетического распределения ионов Na^+ и K^+ , прошедших через тонкие пленки меди

З. А. Исаханов

91

Особенности воздействия вакуумного дугового разряда на поверхность металлического катода в присутствии гидроксидов и хлоридов щелочных металлов

*В. Н. Арустамов, Х. Б. Ашуров, А. М. Миркаримов, С. Л. Пожаров,
Х. Х. Кадыров, И. Х. Худайкулов*

95

Влияние низкотемпературного ($20-60^\circ\text{C}$) нагрева кремния на его микротвердость

Д. И. Тетельбаум, Е. В. Курильчик, Г. П. Похил, А. А. Кузьмина (Пяткина)

102

Об отрицательном значении поверхностной энергии при сжатии или растяжении кристалла

М. Н. Магомедов

107